U.D.C. 669.11: 620.185: 621.385.833

# 鉄鋼組織の電子顕微鏡的研究

The Electron Microscopic Study on Structure of Iron and Steel

## 菊田光男\*守谷光正\*

#### 内 容 梗 概

鉄鋼の主として焼鈍軟化状態の組織におよぼす研磨方法の影響,すなわち機械研磨と電解研磨の比較 を電子顕微鏡を用いて調べた結果,機械研磨において最終のバフ仕上と腐蝕を繰返さないと純鉄では正 確なフェライトおよび結晶粒界を現出せず,粒状セメンタイト組織の場合は雑然とした腐蝕されやすい 基地および過大炭化物を生じ,網状セメンタイトは現われない場合すらある。バフと腐蝕を繰返せば正 確な組織をうるが電解研磨法はどの場合も迅速に正しい組織を現出する。また従来から問題になつてい た層状パーライト中のセメンタイトの厚さにかんして検討を加えた結果,セメンタイトーフェライト間 が電解腐蝕のため溝を生じこれをレプリカにとり電子顕微鏡写真に撮つた場合,実際より厚くみえる場 合のあることをあきらかにした。

## 〔I〕緒 言

著者らはさきに試料研磨の迅速化をはかり交流電解研 磨法について検討<sup>(1)</sup>したさい,機械研磨による場合とこ となる組織をうることがあり,鉄鋼の顕微鏡組織におよ ぼす研磨法の影響について光学顕微鏡を用いて研究を行 い,従来のエメリーペーパおよびバフ琢磨による方法で は特に焼鈍軟化状態の試料においては変質層のため真の 組織を現出しない場合があることをあきらかにした<sup>(2)</sup>。 本報はこの現象をさらに微細に追及するため電子顕微鏡 を用いて研究したものである。 2回とした。これに対し電解研磨はエメリー4/0まで は機械研磨と同様であるが、その後は交流電解研磨<sup>(1)</sup>を 行つた。

電子顕微鏡試料作製はメチルメタクリルーアルミニウ ム法を用い,クロムのシャドウイング照射角度は大部分 45°にとつた。そのほかの電子顕微鏡関係の操作は通常 の方法によつた。

〔III〕 実験結果およびその検討

(1) フェライト組織

## 〔II〕 試料および実験方法

第1表(次頁参照)は本研究に供した試料の化学成分 を示す。試料の研磨法はグラインダ削磨後エメリーペー パで順次研磨し 6/0 仕上後,バフ(ベンガラ)琢磨し た後3%硝酸アルコールで腐蝕したものを機械研磨1回 とし,これを再びバフ琢磨と腐蝕したものを繰返研磨 第1図は850°Cに2時間加熱焼鈍した電磁軟鉄(HR: (B)44)をエメリーペーパ研磨後バフ琢磨を1回行い腐 蝕した場合で結晶粒界のあらわれた例である。この場合 の基地フェライトは不規則な凹凸がはなはだしい。全面 にわたる起伏も大きい。これはエメリー研磨のさい生じ た不安定な加工歪層が十分除去されなかつたものと考え られる。

第2図はバフ腐蝕を2回繰返した場合で基地フェライ



- 第1図 電磁軟鉄 (S000), 1回 バフ研磨後腐蝕 (3% 硝酸アル コール) (×2,000)
- Fig. 1. Magnetic Pure Iron (S000), After First Buff Polished, Etching by 3% Nital
- \* 日立金属工業株式会社安来工場
- 第2図 電磁軟鉄,バフ研磨,腐 蝕を2回繰返した場合
  - (×2,000)
- Fig. 2. Magnetic Pure Iron, Repeated Buff Polishing and Etching
- 第3図 電磁軟鉄,バフ研磨,腐 蝕を各5回繰返した場合

# (×2,000)

Fig. 3. Magnetic Pure Iron, Repeated Five Times Each Buff Polishing and Etching

#### 鉄鋼組織の電子顕微鏡的研究

第1表 試料の化学成分 Table 1. Chemical Analysis of Specimen

副	5	料	記			号	С	Si	Mn	Р	S	Ni	Cr	Cu
電	磁軟	鉄		S0	00		0.01	0.07	Tr	0.008	0.011	Nil	0.04	0.04
双	物	鋼	白	紙	2	号	1.15	0.11	0.14	0.013	0.003	Nil	0.07	0.02
双	物	鋼	白	紙	1	号	1.42	0.13	0.32	0.014	0.002	Nil	0.07	0.03



第4図 双物鋼(白紙2号.850°C 焼鈍)バフ研磨1回,腐蝕 (×2,000)

- Fig. 4. Cutlery Steel (Shirokami No. 2, Annealed at 850 °C) after First Buff Polished, Etching
- 第5図 双物鋼(第4図のもの) をさらにバフ研磨,腐蝕繰返 (×2,000)
- Fig. 5. Cutlery Steel (Same Specimen as Fig. 4) Repeated Buff Polishing and Etching
- 第6図 双物鋼(第4図のもの) 電解研磨後3%硝酸アルコール 腐蝕(×2,000)
- Fig. 6. Cutlery Steel (Same Specimen as Fig. 4) After Electrolytic Polishing, Etching by 3% Nital

トは微細組織を示し、結晶粒界は不鮮明で一部に研磨症 が認められる。軟質金属を研磨する場合、一度消えた研 磨疵が腐蝕によつて再びあらわれることはしばしば経験 するところで、これはバフ琢磨のさいのいわゆる Beilby Layer、非晶質流動層によるものと考えられる。結晶粒 界のあきらかでないのも変質層によるもので、微細組織 は加工歪層中あるいは直下の微細結晶層が出現したのか もしれない。

第3回はこれをさらにバフ,腐蝕を繰返した例で上記 の微細組織は消え一様なフェライトおよび鮮明な結晶粒 界が認められる。通常電磁軟鉄の場合はよほど丁寧な研 磨を行うか,バフと腐蝕を3回以上繰返さないと,結晶 粒そのものすら出現しない場合がある。第3回はほとん ど力を加えず表面層を除去したもので,これ以上バフと 腐蝕を繰返しても組織は変化しない。同じ試料を電解研 磨した場合も第3回とほとんど同様組織を示す。

前述のエメリー研磨による加工歪層あるいはバフの琢 磨による流動非晶質層(これはエメリーペーパでも目が 非常に細かくなると生ずるものと考えられる)などの変 質層を考慮すれば純鉄の電子顕微鏡組織は第3図すなわ ちバフと腐蝕を繰返すか電解研磨した場合が正しいとい えよう。たゞし deep etching を施した場合は純鉄特有 の立方面結晶構造が基地に出現するが、これについては 別の機会に述べたい。

(2) 粒状セメンタイト組織

第4図は白紙2号の850℃焼鈍試料をエメリー研磨後 1回バフ琢磨および腐蝕を施した場合である。この場合 のエメリー研磨はやゝ圧力を加えながら行つたが,基地 は複雑な形状の炭化物らしいものが密集し,いちじるし く大きな炭化物が分布し,その表面は扁平で若干微孔が ある。光学顕微鏡ではこの大きな炭化物は真白くみえ, 基地は腐蝕されやすく黒くなる。第5図はこれを再びバ フ琢磨し腐蝕したもので基地の雑然とした小炭化物はそ の数を減じ一部に層状の炭化物が認められる。大なる炭 化物もやムその大さを減ずる。光学顕微鏡では基地中フ ェライトらしい白色部が認められる。第6図は同一試料 を電解研磨した場合であつて, 粒界を有するフェライト 基地中に粒状のセメンタイトおよび遊離セメンタイトを 分布することがあきらかである。また粒状セメンタイト も第4図~第6図の順に丸味を帯びてくることが認めら れる。この場合も論ずるまでもなく電解研磨組織が金相 学的に正しいことがあきらかで, エメリーペーパ研磨後 の仕上不十分のときは表面変質層のため不正確な組織を 現出することが認められる。

本実験においてなぜ機械研磨で過大炭化物を出現するかということが問題となるが、これについては別に詳細

---- 37 -----



第7図 双物鋼の層状パーライト (950°C 焼鈍)機械研磨(×2,000) Fig. 7. Lamellar Parlite of Cutlery Steel (Annealed at 950°C) Mechanical Polishing

第8図 第7図と同じ試料電解研 磨 (×2.000)

Fig. 8. Same Specimen as Fig. 7 Electrolytic Polishing



- 第9図 三上氏の層状パーライトにかんする説明図 (共析セメンタイト0.9%C a/b=6.2/1)
- Fig. 9. Mikami's Diagrams on Lameller Pearlite (Eutectoid Cementite 0.9%C, a/b=6.2/1)

明にあらわれる。特に網状セメンタイ トの幅はバフと腐蝕を繰返すほど細く なる。電解研磨でははじめから繰返最 終組織をうる。

別冊第16号

この場合も機械研磨のさい生じた加 工歪層および流動層が影響するものと みられる。なお光学顕微鏡では網状セ メンタイトの幅に関する繰返研磨の影 響が上述のように認められるが、電子 顕微鏡ではその機能上ごく一部の組織 しか観察できないから網状セメンタイ トの幅の変化を比較することは困難で ある。

(4) 層状パーライトについて 第7図に機械研磨した場合の層状パ ーライトの一例を,また第8図に電解 研磨した場合の一例を示す。この場合 も機械研磨はバフと腐蝕を繰返してい る。この両者を比較して直感すること は電解研磨した組織では層状のセメン タイトと隣接するセメンタイトとの間 隔すなわち層状セメンタイト間の基地 フェライトの幅が広いことである。 本来層状パーライトは Ar<sub>1</sub> 変態の さい共析成分のオーステナイトからセ メンタイトが一定割合でフェライトと ともに析出し,その機械的な配合割合 はほかの元素の影響をうけない場合お よび析出が阻止されるほど急速な冷却 をうけない限り一定であるべきであ る。したがつてある成分試料の層状パ ーライトは常に一定な間隔比をもつて 観測されるはずである。





第10図 電子顕微鏡組織より推定した層状パーライト 組織の切断説明図(共析セメンタイト 0.9% C) Fig. 10. Assumed Section Diagrams of Lamellar Pearlite by Electron Microstructures (Eutectoid Cementite 0.9% C)

### な研究結果を報告する予定である。

(3) 網状セメンタイト組織

白紙2号を Acm 線以上 950°C より徐冷し遊離セメン タイトを網状に析出させた標準組織試料をエメリーペー パでやゝラフな研磨を行いバフ仕上げ腐蝕した場合は 光学顕微鏡下では黒く雑然と腐蝕された基地中に幅の広 い網状セメンタイトが白くあらわれるが、電子顕微鏡組 織では全面に無数の腐蝕孔を有する不明瞭な基地中に網 状セメンタイトらしいものがぼんやりと認められるだけ である。この場合もバフと腐蝕を数回繰返すと網状セメ ンタイトおよびフェライト基地中の層状パーライトが鮮

パーライトはその真珠色の光沢のた め Howe により Pearlite と命名され

たことはあまりに有名であるが、その顕微鏡組織につい ては従来より種々論議されてきた。すなわち Howe, Ruer<sup>(3)</sup>, Osmond<sup>(4)</sup>らは腐蝕液に対し溶解度を異にする ためセメンタイトがフェライトより浮出ると考え、さら に Heyn<sup>(5)</sup> は浮彫の原因を主としてフェライトとセメン タイトの硬度差により研磨のさいに生ずるものとした。 Sauveur<sup>(6)</sup> も Heyn と同様に考えかつフェライトは腐 蝕により幾分着色するため Contrast の関係でセメンタ イトは実際の幅より大きくみえるとし、また Edwards(7) はパーライトは初析フェライトまたは初析セメンタイト に比し非常に細い組織であるから腐蝕液の電解作用がい

---- 38 -----

鉄鋼組織の電子顕微鏡的研究

ちじるしくフェライトセメンタイトの境界が侵されるため実際より厚くみえると報告している。

三上<sup>(3)</sup>はこれらの問題を解決する一手段として平面上 に板状のパーライト模型を作り投光角度を変えて実験を 行つた。**第9**図はその説明図である。すなわちFe-Fe<sub>3</sub>C 系合金の共析炭素量を 0.9% とした場合, Fe<sub>3</sub>C として は 13.5% であるからパーライトにおけるセメンタイト とフェライトの厚さの比は (イ) のごとく a:b = 6.2:1 にならねばならない。しかし実際にはパーライトは研磨 面に対し (ロ) のごとく  $\theta$ なる角度をもつ場合が多いか ら b/a が 6.2/1 であつても顕微鏡下ではセメンタイト の幅はC, フェライトはFの幅をもつていることになり 実際のセメンタイトの厚さ C<sub>2</sub> より大きく観察されるの であるとしている。

しかしこの場合問題となるのはセメンタイトの浮彫高 さであり,三上氏の模型のごとくフェライト面より薄い セメンタイト板が大きく浮出るかどうかである。事実電 子顕微鏡組織よりシャドウイングからこの高さを計算し てみると平均してセメンタイトの厚さの1/2以下であつ た。第10回はこの場合の説明図でセメンタイトとフェラ イトの幅の比a/bはやはり 6.2/1 にとつてあるが、セメ ンタイトの浮彫高さはセメンタイトの観測幅Cの1/2とす ると F/C は約1/5になる。実際のフェライトとセメンタ イトの厚さの比は F'/C'=6.2/1 である。すなわちパーラ イトにおけるセメンタイトとフェライトの厚さは約 5/1 ~6.2/1 でなければならないが,実際の組織中では1/3に 近い場合が認められる。こゝで考えられるのは浮彫セメ ンタイトはなにかの原因で実際の厚さより大きくなつて いるのか,またはなお観測上ミスがあるかの二点になる。 こゝでは後者について検討してみたい。



第11図 層状パーライトのレプリカおよ び電子顕微鏡陽画説明図 (メチルメタ クリルーアルミニウム法)

Fig. 11. The Diagrams of Replica and Positive Electron Micrograph of Lameller Pealirte (Methylmethacryl Aluminium Method)



前述の Edwards<sup>(7)</sup> はフェライトとセメンタイトの境 界腐蝕を提唱したが,近藤<sup>(9)</sup>は球状セメンタイトの研究 で粒界腐蝕はないものとしている。しかして実際の電子 顕微鏡組織では大部分の炭化物の周囲に溝があるように みられる。これを考慮に入れると**第10**図の拡大部のごと くになりやはりCのとり方が問題になつてくる。とくに 電子顕微鏡では色によつてセメンタイトを区別できない からなお複雑になつてくる。

以上の点をあきらかにする一方法としてパーライト組 織におけるレプリカの黒化度について検討してみた。第 11図(イ)はセメンタイトとフェライト間に境界腐蝕があ るものとした場合のモデルに樹脂を流したときを,(ロ) は試料よりこの樹脂を剥離した場合で点線部は Keying Action を示す。(ハ)は Al 膜の蒸着および Cr シャド ウイングを示す。(ニ)はこのレプリカに電子線を透過さ せた場合で結局電子顕微鏡組織(陽画)としては(ホ) 第12図 各種レプリカと電子顕微鏡陽画との関係 Fig. 12. The Relation of Each Replica and Positive Electron Micrograph

(口)

のごとくなるはずである。(ニ)(ホ)図においてセメン タイトの幅は3あるいは4~9であるが、実際の写真上 では区別がつけがたい。第7図はほゞこの(ホ)図と一 致するがパーライトはあらゆる方向に析出し Cr シャド ウの照射角に対しても各方向位置を示すから(ホ)図を すべての代表にするわけにはいかない。

第12図はこの点を考慮に入れた各種レプリカおよび電 子顕微鏡陽画の関係を示したものである。すなわち(イ) はセメンタイトフェライト間に境界腐蝕がないとする場

---- 39 -----

合を,(ロ)は境界腐蝕がある場合で第11図(ホ)以外の 例を示す。これらと実際の電子顕微鏡写真を比較すると (イ)に相当する場合はほとんどなく(ロ)および前図 (ホ)に相当するものがもつとも多い。たとえば第8図 はこの(ロ)に該当する。すなわちパーライトのセメン タイト境界は電解腐蝕をうけ基地フェライトより低くな つていることを裏付ける。

以上述べたところによりパーライトの電子顕微鏡組織 にかんする金相学的観点があきらかとなつたが,セメン タイトとフェライトの面積比の問題に対しては第12図 (ロ)の場合,実際のセメンタイトの厚さよりやゝ大き くみえるだけで決定的な理由は附与しえない。

普通炭素鋼の共析炭素濃度 0.9% はその後漸次減少 し,0.83% あるいはそれ以下であるとの説も最近出てい るので,もしこれが正しければセメンタイトとフェライ トの面積比はさらに大きくなるわけである。これらのこ とを考慮に入れると,たとえセメンタイトと隣接するフ ェライトが電解腐蝕され,その境界に溝を生ずるため電 子顕微鏡組織では実際のセメンタイトの厚さより大きく みえるとしても,やはりパーライト組織のセメンタイト 間隔は相当はなれている場合,すなわち電解研磨組織の 方が正しいものと想像される。 腐蝕を繰返せばよい。これに対し電解研磨は迅速に正確な組織を現出しうる。

(2) 粒状セメンタイト組織の場合,機械研磨では過 大炭化物の分布する変質層をあらわす場合があり,この さいはやはり数回バフと腐蝕を繰返す必要がある。電解 研磨はこのような現象を示さない。網状セメンタイト組 織についても同様のことがいえる。

(3) 層状パーライトも機械研磨では数回バフと腐蝕 を繰返す方がよい。また層状パーライト中のセメンタイトの厚さはセメンタイトとフェライト間に電解腐蝕によ る溝を生ずるため実際の厚さより大きく観察される場合 もあると考えられる。

なお機械研磨のため過大炭化物を生ずる原因および研 磨機構については別の機会に報告したい。

本研究を終るにあたり終始御教示賜つた小柴冶金研究 所長に感謝の意を表する。

#### 参考文献

- (1) 菊田, 塩谷: 日立評論 38 No. 8 (1956)
- (2) 菊田: 日本金属学会昭和31年度春期大会講演概要 (1956)
- (3) R. Ruer: Metallographie in Elementarer Darstellung 2 Aufl, 243 (1921)
- (4) F. Osmond: Microscopic Analysis of Metals 17 (1913)

〔IV〕 結 言

金属組織におよぼす研磨法の影響を電子顕微鏡により 検討した結果つぎの結論をえた。

(1) フェライト組織を機械研磨する場合は加工歪層 あるいは微細結晶層をあらわし,真のフェライトおよび 結晶粒界を現出しない場合がある。これらの変質層を完 全に除去するには,エメリー研磨後数回バフ琢磨および

- (5) E. Heyn: Die Theorie der Eisen Kohlenstoff Legierungen 22 (1924)
- (6) A. Sauveur: The Metallography and Heat Treatment of Iron and Steel 49 (1926)
- (7) C.A. Edwards: The Physico Chemical Properties of Steel 59 (1916)
- (8) 三上: 金属の研究 V.8 351 (1931-6)
- (9) 近藤: 日本金属学会誌 V.7 484 (1942-11)

